

# CT6201-DC

CoC 测试系统

Version 1.8



## 产品描述

联讯仪器 CT6201 是全自动的CoC测试系统，便捷高效使其成为 CoC大规模量产的最佳选择。采用和联讯仪器 BI6201 相同的测试夹具，降低了被测芯片上下料的流程，同时也消除了上下料过程中EOS/ESD潜在风险。专利设计的光功率耦合系统设计，确保了光学耦合和光谱测量的快速性和重复性。特有的双测试载台设计，每个载台可以独立温控，节省升降温等待的时间，配合 CoC 夹具双侧并行测试，大大提高了测试效率。

## 产品特点及优势

- 同CoC老化系统共用相同的测试夹具，老化到测试过程中针板不分离；
- 温度控制范围大：25-100 °C；
- 温度稳定度高：<±0.1 °C
- 双测试载台，单个载台可以支持双侧并行测试，从而大大提高了测试效率；
- 支持自动上下夹具，不仅提高整个测试效率，同时避免人工取放夹具引入的外力损坏；
- 极高的测试速度：每个CoC（DFB）测试时间<7 s；
- 阈值电流重复性：<±1%；
- 功率重复性：<±1%
- 波长重复性：<±0.15 nm；
- SMSR重复性 <5 dB；
- 支持直流或者脉冲电源驱动激光器；
- 集成联讯仪器精密源表；
- 可配置的测试软件和数据库界面；

## 技术指标

系统参数	芯片类型	CoC/CoS
	夹具类型	支持CoC老化系统相同的夹具 标准 48 pcs 芯片夹具（可以定制）
	上下夹具	自动上下夹具
	夹具ID扫描识别	夹具Barcode自动扫描识别
	并行测试	CoC夹具双侧并行测试
	标准样品控制	软件支持标准样品管控功能。 如果标准样品在本机台测试超过时间周期（可配置），系统自动告警
	测试机台控制	软件支持测试机台管控功能，相同夹具在老化前后分别在不同的测试机台进行测试，软件会自动产生告警提示。
	测试配置管控	软件支持测试配置管控，包括测试仪表，测试算法，测试序列，测试结果判断等。
	测试数据	支持用户要求的所有测试数据/支持MES相关的需求
电学指标	SMU类型	标准精密源表
	直流电流	3 A
	I/V 源分辨率	10 fA/100 nV
	I/V 测量分辨率	10 fA/100 nV

	电压范围	70 V
	脉冲电流	10 A
	EOS	无EOS (任何正常操作和使用条件下)
光学指标	光功率测量探测器类型	Ge
	光功率波长范围	800-1700 nm
	光功率测量范围	10 $\mu$ W-300 mW (>25 mW需加衰减片)
	光功率测量精度	<0.2 dB
	光谱测量范围	集成横河AQ6360或其他光谱仪
	光谱测量精度	
	光功率耦合效率	耦合功率>-15 dBm
温度控制指标	温度控制方法	TEC
	温度区域	2个独立的温度控制区域 (双载台)
	温度范围	25 $^{\circ}$ C-100 $^{\circ}$ C
	温度变化速度 (升温/降温)	20 $^{\circ}$ C/分钟
	温度分辨率	0.01 $^{\circ}$ C
	温度精度	25 $^{\circ}$ C-100 $^{\circ}$ C: $\pm$ 0.5 $^{\circ}$ C+1% $\Delta$ T
	温度一致性	< $\pm$ 0.5 $^{\circ}$ C
	温度稳定性	< $\pm$ 0.2 $^{\circ}$ C
测试参数	lth重复性	$\pm$ 1%
	功率重复性	$\pm$ 1%
	SE 重复性	$\pm$ 2%
	波长重复性	< $\pm$ 0.15 nm
	SMSR 重复性	<5 dB

## 采购信息

CT6201-DC	标准配置
-----------	------

## 联系我们

### 邮箱

[sales@semight.com](mailto:sales@semight.com)

### 地址

苏州高新区湘江路 1508 号

### 官网

更多信息请访问 [www.semight.com](http://www.semight.com)

\*本文中的产品指标和说明可不经通知而更新